

Telezentrisches Messobjektiv mit integrierter Auflichtbeleuchtung JENmetar™ 1x/18A.



Höchste Präzision.
Große Zuverlässigkeit.
Sichere Handhabung.

Ein idealer optischer Baustein für:

- Messende Bildverarbeitung.
- Oberflächeninspektion.
- Objektidentifikation.
- Objektanalyse.
- Positionsbestimmung.

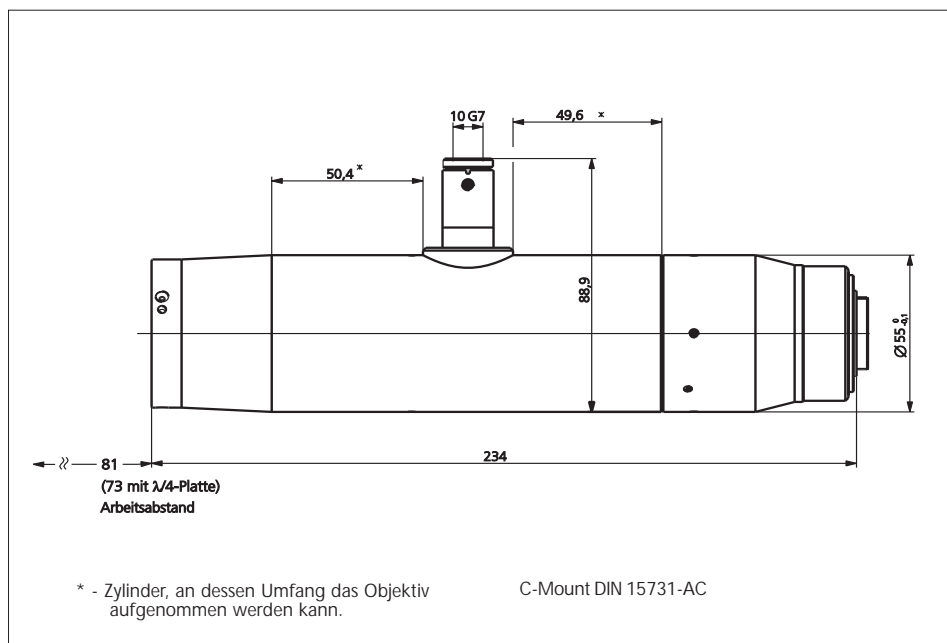
Das JENmetar™ 1x/18 A vereint in sich die exzellenten optischen Eigenschaften der JENmetar™ - Reihe mit den Vorzügen einer telezentrischen Auflichtbeleuchtung. Es garantiert eine sehr gute optische Auflösung bei einer günstigen Objektfeldgröße. Die integrierte Auflichtbeleuchtung ist eine besonders kompakte Lösung für Abbildung und Beleuchtung.

Durch die Nutzung polarisierten Lichtes ergeben sich einmalige Möglichkeiten für die gezielte Veränderung des Kontrastes im Bild einschließlich der Darstellung von Strukturunterschieden der Oberflächen. Als Zubehör dafür wird eine $\lambda/4$ - Platte angeboten.

Kamera - Anschluss:	c - mount
Maximales Bildfeld:	Ø 18 mm
Maximales Objektfeld:	Ø 18 mm

Kamera-Chip Sichtbares Objektfeld	
1"	12,8 x 9,5 mm ²
2/3"	8,8 x 6,6 mm ²
1/2"	6,4 x 4,8 mm ²

Telezentrisches Meßobjektiv mit integrierter Auflichtbeleuchtung JENmetar™ 1x/18A.



Angaben zur Beleuchtung:

Hellfeld - Auflicht - Beleuchtung mit polarisiertem Licht, optional mit $\lambda/4$ - Platte.

Wellenlängenbereich
520nm ...650 nm.

Einkopplung des Lichtes über Lichtleitfaser mit einem aktiven Faserdurchmesser größer 4 mm.

Ausgeleuchteter
Objektfelddurchmesser 18 mm.

Telezentrische Abbildung
der Lichtquelle.

Technische Daten:

Abbildungsmaßstab:	-1 (-1:1)
Freier Arbeitsabstand:	81 mm
mit $\lambda/4$ -Platte:	73 mm
Abstand Objekt - Kamerachip:	333 mm
Maximale Verzeichnung:	$\leq 0,05 \%$
Bildseitige Apertur:	0,05
Objektseitige Schärfentiefe:	$\pm 0,11$ mm bei $11\mu\text{m}$ Kantenverwaschung $\pm 0,55$ mm bei $50\mu\text{m}$ Kantenverwaschung
Telezentriebereich*:	9 (3) mm
Masse:	ca. 1200 g
Bestellnummer:	017102-104-26
$\lambda/4$ -Platte:	
Bestellnummer:	017102-204-25

* Bereich der axialen Objektverschiebung, bei dem sich der Bildort um maximal $3\mu\text{m}$ ($1\mu\text{m}$) ändert.

Design und Spezifikation der Objektiv unterliegen der ständigen Weiterentwicklung.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.

JENOPTIK Laser, Optik, Systeme GmbH
Geschäftsbereich Optik
Göschwitzer Straße 25
D-07745 Jena
Deutschland

Telefon: +49-3641-65 3311
Fax: +49-3641-65 3677
E-Mail: optics@jenoptik.com
Internet: www.jenoptik-los.de